

《基体与超导体体积比测量 Cu/Nb Ti复合超导体铜-超[体积]比的测量》

书籍信息

版次：1

页数：6

字数：14000

印刷时间：2009年03月01日

开本：大16开

纸张：胶版纸

包装：平装

是否套装：否

国际标准书号ISBN：GB/T22587-2008

内容简介

本标准修改采用IEC 61788—5：2000《超导电性第5部分：基体—超导体体积比测量Cu/Nb-Ti复合超导体中铜—超[体积]比的测量》。

本标准在语言及文字方面，包括标点符号等进行了适当的编辑性修改。在技术性方面，IEC 61788—5中要求使用分辨率为0.1mg的天平对样品进行质量测量，而要求质量测量的准确度为0.1 mg，这是不合适的。对于实际分度值D=0.1mg的天平，其检定分度值e=10D=1mg，即测量可准确到1mg。本标准将文本中涉及质量测量准确度的4处（7.5、7.9、9和A.4）出现的相应数值，从0.1mg修改为可准确到1mg。

本标准的附录A为规范性附录；附录B、附录C及附录D为资料性附录。

本标准由全国超导标准化技术委员会归口和提出。

本标准负责起草单位：西北有色金属研究院、西部超导材料科技有限公司。

本标准参加起草单位：北京有色金属研究总院，中国科学院电工研究所、中国科学院物理研究所。

本标准主要起草人：卢亚锋、刘宜平、汪京荣、熊晓梅、李林、郑明辉、王银顺。

本标准为首次发布。

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

[更多资源请访问www.tushupdf.com](http://www.tushupdf.com)